

## ПРОГРАММА СЕМИНАРА БЕЛСЗМ-2006

<b>1 ноября 2006 г.</b>	
9:00 – 14:00	РЕГИСТРАЦИЯ
14:00 – 14:30	ОТКРЫТИЕ 7-го Международного семинара «Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии» – БелСЗМ-2006
14:30 – 16:00	<i>Председатель: член-корр НАН Беларуси Плескачевский Ю. М.</i>
14:30 – 14:50	<i>Свириденко А. И.</i> (Гродно, Беларусь) <b>Актуальные проблемы применения СЗМ в Беларуси</b>
14:50 – 15:10	<i>Жавнерко Г. К., Агабеков В. Е.</i> (Минск, Беларусь) <b>Метод микроконтактной печати, локальная модификация поверхности и интерпретация данных сканирующей зондовой микроскопии</b>
15:10 – 15:30	<i>Брич М. А., Чижик С. А.</i> (Минск, Беларусь) <b>Моделирование взаимодействия углеродной нанотрубки, как зонда АСМ, с кристаллом алмаза</b>
15:30 – 15:45	<i>Миронов В. Л., Грибков Б. А., Никитушкин Д. С., Фраерман А. А.</i> (Нижний Новгород, Россия) <b>Магнитно-силовая микроскопия ферромагнитных наночастиц</b>
15:45 – 16:00	<i>Миронов В. Л., Никитушкин Д. С., Грибков Б. А., Гусев С. А.</i> (Нижний Новгород, Россия) <b>Магнитно-силовая микроскопия слабоэрозивтивных ферромагнитных наночастиц</b>
16:00 – 16:30	ПЕРЕРЫВ
16:30 – 18:10	<i>Председатель: Жавнерко Г. К.</i>
16:30 – 16:50	<i>Чижик С. А., Шкадаревич А. П., Кузнецова Т. А., Курганович А. М.</i> (Минск, Беларусь) <b>Контроль поверхностей лазерной оптики методом АСМ</b>
16:50 – 17:10	<i>Berezina S., Zinin P., Koehler B.</i> (Жилина, Словакия) <b>Nondestructive characterization of thick DLC-films</b>
17:10 – 17:30	<i>Ясинский В. М., Ивакин Е. В., Суходолов А. В., Хайруллина А. Я., Кокиц А. Н.</i> (Минск, Беларусь) <b>Исследование особенностей возбуждения плазмон-поляритонов в периодически наноструктурированных металлических пленках методом фотонной сканирующей туннельной микроскопии</b>
17:30 – 17:50	<i>Сошников А. И., Гоголинский К. В., Решетов В. Н.</i> (Троицк, Россия) <b>Исследование с помощью СЗМ «Наноскан» свойств области контакта токопроводящих алмазных зондов с поверхностью</b>
17:50 – 18:10	<i>Kukhareenko L. V., Fuchs H., Leshchenko V. G., Gelis L. G., Lazareva I. V.</i> (Минск, Беларусь) <b>Surface morphological change investigation in surface activated platelets with the scanning force microscope</b>
<b>2 ноября 2006 г.</b>	
9:00 – 11:00	<i>Председатель: Миронов В. Л.</i>
9:00 – 9:20	<i>Плескачевский Ю. М., Суслов А. А., Чикунов В. В., Цуан Янь, Чижик С. А.</i> (Минск, Гомель, Беларусь) <b>Самоорганизация поверхностных слоев твердых покрытий при трении</b>
9:20 – 9:40	<i>Wielgo K., Ekwinska M., Rymuza Z.</i> (Варшава, Польша) <b>Nanoindentation studies of oxynitride ultrathin films for MEMS applications</b>
9:40 – 10:00	<i>Pustan M., Rymuza Z.</i> (Варшава, Польша) <b>Scale effect on mechanical properties of movable MEMS structures tested by AFM</b>
10:00 – 10:20	<i>Балабанова Н., Чикунов В. В., Римуза З.</i> (Варшава, Польша; Минск, Беларусь) <b>Влияние сонорных осцилляций и топографии поверхности на адгезионные свойства полимерных покрытий</b>
10:20 – 10:40	<i>Kozzewski A., Gorski T., Rymuza Z.</i> (Варшава, Польша) <b>Estimation of Young's modulus of ultrathin polymeric films for nanoimprint lithography by use of AFM</b>
10:40 – 11:00	<i>Chizhik S. A., Vo Thanh Tung, Chikunov V. V., Nguyen Tho Vuong</i> (Минск, Беларусь; Вьетнам) <b>Force interactions in shear-force and tapping modes with quartz tuning fork based on atomic force microscopy</b>
11:00 – 11:30	ПЕРЕРЫВ
11:30 – 13:10	<i>Председатель: Ясинский В. М.</i>
11:30 – 11:50	<i>Игнатовский М. И.</i> (Гродно, Беларусь) <b>К вопросу о применении зондовой микроскопии для исследования полимерных композитов</b>
11:50 – 12:10	<i>Романюк В. Л., Гременок В. Ф., Меркулов В. С., Залесский В. Б., Ермаков О. В., Чиурич Г. Г., Сякерский В. С., Абетковская С. О.</i> (Минск, Беларусь) <b>Исследование морфологии поверхности тонких сегнетоэлектрических пленок <math>Ba_xSr_{1-x}TiO_3</math> с помощью атомно-силового микроскопа</b>
12:10 – 12:30	<i>Гончарова О. В., Гременюк В. Ф., Чижик С. А.</i> (Минск, Беларусь) <b>Применение сканирующей зондовой микроскопии для исследования влияния толщины пленочных слоев сульфида индия на их структуру</b>
12:30 – 12:50	<i>Пилипенко В. А., Петлицкая Т. В., Чижик С. А., Кузнецова Т. А.</i> (Минск, Беларусь) <b>Исследование топологии интегральных микросхем методом атомно-силовой микроскопии</b>

12:50 – 13:10	<i>Сыроежкин С. В., Журавский В. С., Губанов А. В., Чижик С. А.</i> (Минск, Беларусь) <b>Многоуровневая реконструкция АСМ-изображений</b>
13:10 – 13:30	<i>Артамонов В. В., Алексеенко А. А., Бойко А. А., Подденежный Е. Н.</i> (Гомель, Беларусь) <b>Применение метода СЗМ для анализа структурных особенностей гель-стекол и керамики</b>
13:30 – 14:30	<b>ОБЕД</b>
14:30 – 15:45	<i>Председатель: Суслов А. А.</i>
14:30 – 14:50	<i>Довбешко Г. И., Фесенко О. М.</i> (Киев, Украина) <b>Структура и свойства металлических нанопервохностей, усиливающих оптические сигналы</b>
14:50 – 15:10	<i>Абетковская С. О.</i> (Минск, Беларусь) <b>Влияние параметров зонда и образца на фазовый контраст и деформирование в контакте зонд-образец для динамического режима АСМ</b>
15:10 – 15:25	<i>Бондаренко М. А., Шевченко Ю. Б., Бойко В. П., Коваленко Ю. И., Яценко И. В., Канашевич Г. В., Ващенко В. А.</i> (Черкассы, Украина) <b>Исследование микрогеометрии поверхности оптических стекол после электронной и после лазерной обработки методом атомно-силовой микроскопии</b>
15:25 – 15:45	<i>Бондаренко М. А., Бондаренко Ю. Ю., Бабаев А. К., Яценко И. В., Рева И. А., Конопальцев Л. И., Ващенко В. А.</i> (Черкассы, Украина) <b>Применение метода атомно-силовой микроскопии в прогнозировании срока эксплуатации пьезоэлектрических преобразователей медицинских приборов</b>
15:45–16:15	<b>ПЕРЕРЫВ</b>
16:15 – 17:35	<i>Председатель: Кухаренко Л. В.</i>
16:15 – 16:35	<i>Стародубцева М. Н., Кузнецова Т. Г., Егоренков Н. И.</i> (Гомель, Беларусь) <b>АСМ исследование эритроцитов, кренированных активными формами азота</b>
16:35 – 16:55	<i>Кузнецова Т. Г., Стародубцева М. Н., Егоренков Н. И.</i> (Гомель, Беларусь) <b>Определение механических свойств клеточных поверхностей</b>
16:55 – 17:15	<i>Слобожанина Е. И., Козлова Н. М., Ясинский В. М., Филимоненко Д. С., Хайруллина А. Я.</i> (Минск, Беларусь) <b>Исследование Zn-индуцированных изменений в эритроцитарных мембранах методом атомно-силовой микроскопии</b>
17:15 – 17:35	<i>Трушко А. В., Чижик С. А.</i> (Минск, Беларусь) <b>АСМ анализ хрящевых тканей</b>

### 3 ноября 2006 г.

10:00 – 11:15	<i>Председатель: Меркулов В. С.</i>
10:00 – 10:20	<i>Джиглавадары И. З., Какошко Е. Ю.</i> (Минск, Беларусь) <b>Исследование упругих растяжений и диссипации энергии на поверхности кристалла методом микродеформаций под действием качающегося шарика</b>
10:20 – 10:40	<i>Айзикович С. М., Кренив Л. И., Трубчик И. С.</i> (Ростов-на-Дону, Россия) <b>Статическое исследование механических свойств функционально-градиентных покрытий при воздействии с поверхности</b>
10:40 – 11:00	<i>Шипица Н. А.</i> (Минск, Беларусь) <b>Исследования поверхности сканирующим датчиком Кельвина</b>
11:00 – 11:15	<i>Циркунова Н. Г., Борисенко В. Е.</i> (Минск, Беларусь) <b>Геометрия зондовой микроскопии: Влияние радиуса закругления зонда на точность формируемого изображения</b>
11:15 – 11:45	<b>ПЕРЕРЫВ</b>
11:45 – 13:00	<i>Председатель: Чижик С. А.</i>
11:45 – 12:10	<i>Киселева О. И.</i> (Москва, Россия) <b>Новое оборудование компании Veeco для исследования свойств полупроводниковых материалов на наноуровне</b>
12:10 – 12:35	<i>Малиновская О. С.</i> (Москва, Россия) <b>Исследование нанотрубок и других углеродных наноструктур с помощью сканирующего туннельного микроскопа НТК «Умка»</b>
12:35 – 13:00	<i>Сулов А. А., Шашолко Д. И.</i> (Гомель, Беларусь) <b>Использование программного пакета SurfaceXplorer для обработки, визуализации и анализа СЗМ-изображений</b>

### СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

СТ 1	<i>Дубравин А. М., Комков О. Ю.</i> (Гомель, Беларусь) <b>Контролируемое перемещение наночастиц по поверхности подложки в режиме кратковременного контакта зонда с поверхностью образца</b>
СТ 2	<i>Дубравин А. М., Комков О. Ю., Yoop Eui-Sung</i> (Гомель, Беларусь; Сеул, Корея) <b>Формирование нанорельефа при локальном окислении поверхности кремния с помощью атомно-силового микроскопа</b>
СТ 3	<i>Дубравин А. М.</i> (Гомель, Беларусь) <b>Моделирование динамического контакта Зонд–Образец.</b>
СТ 4	<i>Дубравин А. М., Комков О. Ю., Браилко Н. Н.</i> (Гомель, Беларусь) <b>Некоторые особенности АСМ изображений и их коррекции</b>

- СТ 5 *Барайшук С. М., Верес О. Г., Ташлыков И. С.* (Минск, Беларусь)  
**Топография и свойства поверхности изделий, модифицированных ионно-ассистированным осаждением покрытий**
- СТ 6 *Чапланова Ж. Д., Михайловский Ю. К., Агабеков В. Е., Ольховик В. К., Галиновский Н. А., Грачева Е. А.* (Минск, Беларусь)  
**Изучение морфологии термонапыленных тонких бензоксазольных производных бифенила методом сканирующей зондовой микроскопии**
- СТ 7 *Ивановский М. И., Свириденко А. И., Смуругов В. А., Ховатов П. А., Чмыхова Т. Г.* (Гродно, Беларусь)  
**Влияние нанонаполнителей на картину износа поверхности стали в субмикронном диапазоне**
- СТ 8 *Kukhareenko L. V., Koshikawa T., Aleinikova O. V., Shman T. V., Krylov A. B., Ivanov A. A., Tsirkunova N. G.* (Минск, Беларусь)  
**Combination of confocal laser scanning microscopy with scanning force microscopy for K562 cells study**
- СТ 9 *Chizhik S. A., Vo Thanh Tung, Chikunov V. V., Nguyen Tho Vuong* (Минск, Беларусь; Вьетнам)  
**Influence of additional mass on quartz tuning fork in dynamic operation mode**
- СТ 10 *Торская Е. В., Горячева И. Г., Чижик С. А., Сыроежкин С. В.* (Москва, Россия; Минск, Беларусь)  
**Определение толщины упругого слоя на твердой подложке методом статической силовой спектроскопии**
- СТ 11 *Кузнецова Т. А.* (Минск, Беларусь)  
**Применение атомно-силовой микроскопии в методах индентирования**
- СТ 12 *Kotov D. A., Dubkova V. I.* (Минск, Беларусь)  
**Application of atomic force microscopy for study of modified carbon fiber surface**

13:00 – 14:00	КРУГЛЫЙ СТОЛ
14:00 – 14:30	ЗАКРЫТИЕ СЕМИНАРА